



自动化仪表 » 2012, Vol. 33 » Issue (9): 64-68 DOI:

新型测试技术与方法

最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

« 前一篇 | 后一篇 »

传统测试设备LXI总线C类接口的改造研究

杨海涛,路欣

总参谋部第63研究所, 江苏南京210007

Research on the Reconstruction Based on LXI Bus C-type I Interface for Traditional Test Devices

摘要

图/表

参考文献

相关文章 (15)



友情链接	广告链接				友情链接
 中国科学技术协会 WWW.CAST.ORG.CN 中国仪器仪表学会 China Instrument and Control Society SIA 上海仪器仪表行业协会 万方数据 WANFANG DATA 知识服务平台 CNKI 中国知网 中国知网基础数据库工程 中华工控网 gkong.com 控制工程网 www.cechina.cn 电气自动化网 ea-china.com 中国仪器与测量网 www.elechina.com 中国电子网	 Gauges, Instruments and Controls 展行仪表 CHENG-U INSTRUMENT SADI 上海仪器仪表 	 安控科技 Endress+Hauser High-Pressure Analyser 虹润 SIPAI 西派埃 HITE 海得控制 上海仪器仪表 Floutontion® SIEMENS	 中科博微 MICROCYBER 中创电子 METTLER TOLEDO YOKOGAMA SHANGHAI WANXUN Automation control 上海万迅仪器仪表有限公司 ANTHONE® 厦门安泰电子有限公司	 Wide Plus KELI SSK SAINT-GOBAIN CERAMICS SHANGHAI KENT 上海肯特 AISEI UDIAN	 控制工程 Control Engineering of China Proceedings of the CSU-EPSCA 电力系统及其自动化学报 仪器仪表学报 自动化学报 ACTA AUTOMATICA SINICA 电气自动化网 www.yjszhi.com 中国仪器仪表信息网 www.cicinfo.com.cn

沪ICP备120323021

版权所有 © 《自动化仪表》编辑部

地址: 上海市漕宝路103号 电话: 021-64368180-231 传真: 021-64368984 Email: pai@sipai.com

技术支持北京玛格泰克科技发展有限公司